

ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (AFM) BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laboratuvarımızda bulunan Park Systems Marka XE100 model atomik kuvvet mikroskopunun X,Y ve Z tarayıcıları için noise ve kalibrasyon ayarların yapılmalıdır.
- Sistemin X,Y ve Z tarayıcılarının offset ayarları yapılmalıdır.
- Sistemin sahip olduğu XEP yazılımı yenilenerek, otomatik tarama modu eklenmelidir.
- Otomatik tarama modu frekans ve gain gibi tüm tarama parametrelerini örneğe göre otomatik olarak ayarlamalıdır.
- Sistemin optik kamera ünitesinin SM yazılımı ile gerekli entegrasyonu yapılmalıdır.
- Sistemin üzerinde kullanıldığı vibrasyon önleyici masanın havalı ayaklarının bakım ve onarım ve kullanım için gerekli tüm ayarları yapılmalıdır.
- Sistemin içinde bulunduğu kabininin amortisörleri yenilenerek kalibrasyonları yapılmalı ve kolayca kullanılabilecek şekilde monte edilmelidir.
- Bakım onarımla birlikte özellikle nano toz örneklerin AFM görüntülerinin alınabilmesi için cleaving mica sheet verilmelidir.
- Yukarıda teknik detayları belirtilen bakım ve onarım işi için, yüklenici firma yetkili servis belgesine sahip olmalıdır.